# Формирование двухфазной структуры в металлоорганическом перовските CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>Pbl<sub>3</sub>

© Д.В. Амасев<sup>1</sup>, В.Г. Михалевич<sup>1</sup>, А.Р. Тамеев<sup>2,3</sup>, Ш.Р. Саитов<sup>4</sup>, А.Г. Казанский<sup>4,¶</sup>

<sup>1</sup> Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук,

119991 Москва, Россия

<sup>2</sup> Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук,

119071 Москва, Россия

<sup>3</sup> Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук,

620137 Екатеринбург, Россия

<sup>4</sup> Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

119991 Москва, Россия

<sup>¶</sup> E-mail: kazanski@phys.msu.ru

Поступила в Редакцию 28 января 2020 г. В окончательной редакции 5 февраля 2020 г. Принята к публикации 5 февраля 2020 г.

> Исследовано влияние отжига пленки металлоорганического перовскита  $CH_3NH_3PbI_3$  на его электрические, фотоэлектрические и оптические свойства. Показано, что отжиг при температуре  $T_a > 140^{\circ}C$  приводит к формированию двухфазной структуры, состоящей из перовскита и иодида свинца, относительное содержание которых зависит от условий отжига, в частности от температуры. Формирование  $PbI_2$  в структуре перовскита приводит к уменьшению проводимости и фотопроводимости материала. Проведенные исследования указывают на возможность формирования планарных структур, состоящих из полупроводниковых материалов с различными величинами запрещенных зон: 1.6 эВ ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) и 2.4 эВ ( $PbI_2$ ).

Ключевые слова: перовскиты, модификация отжигом, двухфазные пленки, фотопроводимость.

DOI: 10.21883/FTP.2020.06.49382.9358

#### 1. Введение

В последние годы металлоорганические полупроводники со структурой перовскита привлекают к себе внимание в связи с большими возможностями создания на их основе эффективных тонкопленочных солнечных элементов. Одним из наиболее популярных материалов среди класса металлоорганических полупроводников является метиламмоний иодида свинца (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>, MAPI). Структура этого металлоорганического полупроводника сформирована из атомов свинца, иода и органической молекулы метиламмония (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>). Исследования показали, что в ряде случаев в сформированной пленке МАРІ присутствует PbI<sub>2</sub>. Присутствие PbI<sub>2</sub> в фотоактивном слое солнечного элемента (пленке перовскита) может быть вызвано как технологическими условиями получения материала [1], так и отжигом структуры при умеренной температуре (~150°С) [2,3].

Было показано, что наличие  $PbI_2$  в составе пленки перовскита влияет на параметры солнечных элементов, созданных на его основе. В частности, увеличение доли  $PbI_2$  в фотоактивном слое до 7.5 мол% может привести к некоторому увеличению эффективности солнечного элемента. Увеличение эффективности структур авторы [4] объясняли тем, что наличие  $PbI_2$  в составе фотоактивных слоев способствует увеличению размеров микрокристаллов, формирующих их, и уменьшению темпа безызлучательной рекомбинации носителей заряда в пленках. При этом в указанных работах проводился в основном анализ влияния  $PbI_2$  на параметры структуры, созданной на основе перовскита. В то же время представляет интерес исследование влияния присутствующего в пленке MAPI иодида свинца ( $PbI_2$ ) на электрические и фотоэлектрические характеристики самой пленки.

Известно, что освещение пленки МАРІ [5,6], нахождение во влажной атмосфере [7] или нагрев до умеренных температур [3] приводит к выделению  $PbI_2$  в структуре пленки МАРІ. В представленной работе для формирования  $PbI_2$  в пленке использовался температурный отжиг. Поэтому было исследовано влияние температуры отжига пленки металлоорганического перовскита  $CH_3NH_3PbI_3$  на его электрические и фотоэлектрические свойства.

# 2. Исследованные образцы и методика эксперимента

В работе исследованы тонкие пленки перовскита  $CH_3NH_3PbI_3$ , толщиной 350-400 нм, осажденные на стеклянную подложку с использованием одноступенчатого метода. Исходный раствор, используемый для получения пленок  $CH_3NH_3PbI_3$ , был изготовлен смешиванием компонентов метиламмония иодида  $CH_3NH_3I$  (MAI) и иодида свинца  $PbI_2$  в мольном соотношении 1:1 в безводном растворе диметилформамида (DMF) [8]. Данный одноступенчатый метод изготовления перовскита  $CH_3NH_3PbI_3$  при использованном нами соотношении  $PbI_2$  и MAI приводит к образованию материала с прово-

димостью *n*-типа [9]. Исследования полученных пленок  $CH_3NH_3PbI_3$  методом сканирующей электронной микроскопии показали, что пленки имеют микрокристаллическую структуру со средним размером микрокристаллов ~ 350 нм.

Для проведения электрических и фотоэлектрических измерений в планарной конфигурации контактов на поверхность пленки методом термического напыления были нанесены контакты из золота. Расстояние между контактами составляло 0.2 мм.

В работе исследовалось влияние температуры отжига  $(T_a)$  на темновую проводимость  $\sigma_d$  и фотопроводимость  $\Delta \sigma_{\rm ph} = \sigma_{\rm ph} - \sigma_d$  (где  $\sigma_{\rm ph}$  — проводимость при освещении) пленки металлоорганического перовскита МАРІ. Измерения спектральных зависимостей фотопроводимости проводились при комнатной температуре после отжига пленки в вакууме при заданной температуре отжига  $T_a$  в течение 10 мин. Температура при последовательных отжигах повышалась от 60 до 160°C. Все измерения выполнялись в вакууме при остаточном давлении ~  $10^{-3}$  Па и при приложенном к образцу напряжении в области линейности вольт-амперной характеристики.

## 3. Результаты экспериментов и их обсуждение

На рис. 1 показаны спектральные зависимости фотопроводимости пленки перовскита, нормированные на число падающих квантов (N) после последовательных отжигов пленки при различных температурах. Как видно из рисунка, при температурах отжига  $T_a \leq 120^{\circ}$ С спектральные зависимости фотопроводимости близки по характеру. В области энергий квантов < 1.6 эВ наблюдается резкое экспоненциальное уменьшение фотопроводимости, что свидетельствует о наличии в исследованных пленках CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub> запрещенной зоны шириной  $\sim 1.6$  эВ. При энергиях квантов hv > 1.6 эВ фотопроводимость слабо зависит от энергии падающих квантов. Из рисунка видно, что при  $T_a \leq 120^{\circ}$ С с ростом  $T_a$  в области  $h\nu > 1.6$  эВ наблюдается лишь небольшое уменьшение фотопроводимости и формирование некоторой особенности при hv > 2.25 эВ.

Наиболее резкое изменение характера спектральной зависимости и величины фотопроводимости происходит после отжига пленки при  $T_a = 140^{\circ}$ С. Наблюдается существенное уменьшение величины фотопроводимости во всем исследованном спектральном диапазоне. При этом в области энергий квантов hv > 2.25 эВ формируется "второй край" фотопроводимости. Примечательно, что после отжига при  $T_a = 160^{\circ}$ С происходит изменение цвета пленки, расположенной между контактами, с темно-коричневого на желтый. Согласно [3], высокотем-пературный отжиг приводит к термическому разложению МАРІ на МАІ и PbI<sub>2</sub>. Таким образом, наблюдаемое изменение спектральных зависимостей фотопроводимости пленки перовскита после ее отжига при  $T_a = 140^{\circ}$ С



**Рис. 1.** Спектральные зависимости фотопроводимости при комнатной температуре, нормированные на число падающих квантов, для пленки перовскита, отожженной при температурах  $T_a = 60$  (1), 80 (2), 100 (3), 120 (4), 140 (5), 160°С (6).

связано с изменением состава пленки и формированием в ее структуре иодида свинца PbI<sub>2</sub>, ширина запрещенной зоны которого составляет 2.4 эВ [1].

Характер спектральных зависимостей фотопроводимости указывает на то, что в формировании фотопроводимости исследованной пленки после ее отжига при 140 и даже при 160°С принимают участие как содержащийся в пленке перовскит CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub> с шириной запрещенной зоны 1.6 эВ, так и иодид свинца PbI<sub>2</sub> с шириной запрещенной зоны 2.4 эВ. Как видно из рисунка, после отжига пленки при  $T_a = 140^{\circ}$ С уменьшение фотопроводимости происходит в большей степени при энергиях квантов < 2.25 эВ. Однако наличие фотопроводимости в области hv = 1.6 - 2.25 эВ указывает на вклад CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub> в генерацию неравновесных носителей заряда в сформированной двухфазной пленке. В то же время большее на 1.5-2 порядка величины значение фотопроводимости при hv > 2.4 эВ по сравнению с фотопроводимостью при hv < 2.25 эВ указывает на определяющую роль иодида свинца в переносе и генерации при  $h\nu > 2.4$  эВ неравновесных носителей заряда в пленке, отожженной при  $T_a = 140$  и 160°С. Таким образом, можно предположить, что в двухфазном материале, сформированном после отжига исходной пленки перовскита при  $T_a = 160^{\circ}$ С, генерация неравновесных носителей заряда происходит как в перовските, так и в иодиде свинца. Перенос же носителей заряда, по-видимому, осуществляется по иодиду свинца (PbI<sub>2</sub>). При этом вклад CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub> в фотопроводимость может быть связан с близостью энергетических положений краев зон проводимости CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub> и PbI<sub>2</sub> [1]. Уменьшение фотопроводимости полученного двухфазного материала во всем исследованном спектральном диапазоне может быть связано как с увеличением концентрации центров рекомбинации и соответственно уменьшением времени жизни, так и с уменьшением подвижности неравновесных носителей заряда.



**Рис. 2.** Температурные зависимости проводимости для пленки перовскита, отожженной при температурах  $T_a = 60$  (1), 80 (2), 100 (3), 120 (4), 140 (5), 160°С (6).

На существенное уменьшение подвижности в исследованных пленках перовскита, отожженных при высоких температурах, указывает изменение проводимости пленок при их отжиге. На рис. 2 показано влияние последовательного отжига при различных температурах на температурную зависимость проводимости  $\sigma_d(T)$  исследованной пленки перовскита. Измерения проводились при понижении температуры после отжига пленки в вакууме при  $T_a$  в течение 10 мин.

Как видно из рис. 2, вид температурных зависимостей близок к активационному. При этом по характеру изменения полученные зависимости можно разделить на два класса: зависимости, полученные для пленки, отожженной при температурах  $T_a \leq 120^{\circ}$ С, и для пленки, отожженной при бо́льших температурах (140 и 160°С). В первом случае на температурных кривых проводимости можно выделить область вблизи температуры  $T = 330 \,\mathrm{K}$  (показана вертикальной штриховой линией), при которой наблюдается некоторое изменение энергии активации проводимости  $(E_a)$  от  $\sim (0.51 - 0.52)$  эВ при меньших температурах до ~ (0.41-0.44) эВ при больших температурах. Это может быть связано с фазовым переходом в структуре перовскита при указанной температуре [10]. Из рисунка также видно, что увеличение температуры отжига до  $T_a = 120^{\circ}$ С приводит к некоторому уменьшению проводимости. В то же время после отжига при  $T_a = 140^{\circ}$ С наблюдается резкое уменьшение проводимости. При этом температурные зависимости проводимости, полученные после отжига при  $T_a = 140$  и 160°С, близки между собой. Величина энергии активации из этих зависимостей близка к значению энергии активации, полученной для "низкотемпературной" области в случае пленки, отожженной при  $T_a \leq 120^{\circ}$ С, и составляет 0.54-0.55 эВ. Отметим также, что на температурных зависимостях проводимости, полученных после отжига при 140 и 160°С, не

3 Физика и техника полупроводников, 2020, том 54, вып. 6

наблюдается двух явно выраженных участков с разными энергиями активации.

Наблюдаемое некоторое уменьшение проводимости после отжига пленки при  $T_a \leq 120^{\circ}$ С можно объяснить формированием широкозонного PbI2 на границах раздела микрокристаллов перовскита [3] и соответственно уменьшением подвижности носителей заряда. В то же время, как и в случае представленных выше спектральных зависимостей фотопроводимости, резкое уменьшение величины проводимости после отжига пленки при  $T_a = 140^{\circ}$ С можно объяснить существенным увеличением доли PbI<sub>2</sub> в составе исследованного материала в результате отжига пленки. Проводимость в исследованном материале определяется концентрацией и величиной подвижности носителей заряда. Как видно из рис. 2, отжиг исследованной пленки перовскита приводил к уменьшению величины проводимости более чем на порядок. При этом энергия активации температурной зависимости существенно не изменялась. Известно, что энергия активации температурных зависимостей проводимости неупорядоченных полупроводников в основном определяется положением уровня Ферми относительно уровня протекания носителей заряда. В свою очередь положение уровня Ферми определяет концентрацию "свободных" носителей заряда. Полученные результаты указывают на то, что в результате отжига не происходит существенного изменения положения уровня Ферми относительно уровня протекания в сформированной двухфазной пленке. В этом случае вызванное отжигом уменьшение проводимости может быть связано с уменьшением подвижности носителей заряда в сформированном в результате отжига двухфазном материале, основную долю в котором составляет иодид свинца PbI<sub>2</sub>.

Заметим, что представленная выше интерпретация полученных результатов основывалась на предположении об однородной структуре пленки по ее толщине и поверхности после ее отжига. В то же время, согласно [3], выделение с поверхности пленки при отжиге перовскита молекул метиламмония может привести к неоднородному по толщине двухфазному составу пленки. Возможность этого следует из рис. 3, на котором показан исследованный образец после отжига при  $T_a = 160^{\circ}$  С.



Рис. 3. Фотография образца после его отжига при  $T_a = 160^{\circ}$ С.

Как видно из фотографии (рис. 3), в областях, которые были покрыты золотыми контактами, в результате отжига цвет пленки не изменился. Это может свидетельствовать о том, что в этих местах в результате отжига не произошло существенного выделения иодида свинца из пленки и соответственно изменения состава пленки. Наличие перовскита под контактами и возможность существования "обогащенного" перовскитом слоя вблизи подложки может привести к наблюдаемому вкладу перовскита в фотопроводимость пленок, отожженных при высоких температурах. Возможность реализации данного эффекта требует дальнейших исследований.

### 4. Заключение

В работе исследовано влияние отжига пленки металлоорганического перовскита CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub> на его электрические, фотоэлектрические и оптические свойства. Показано, что отжиг при  $T_a > 140^{\circ}$ С приводит к формированию двухфазной структуры, состоящей из перовскита и иодида свинца, относительное содержание которых зависит от условий отжига, в частности от его температуры. Формирование PbI<sub>2</sub> в структуре перовскита приводило к уменьшению проводимости и фотопроводимости материала. Это указывает на то, что отмеченное в работах [1,3] улучшение параметров солнечных элементов на основе CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub> при введении в него PbI<sub>2</sub>, повидимому, не связано с улучшением фотоэлектрических параметров самого фотоактивного слоя. Проведенные исследования указывают на возможность формирования планарных тонкопленочных структур, состоящих из полупроводниковых материалов с различными величинами запрещенных зон: 1.6 эВ (CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>PbI<sub>3</sub>) и 2.4 эВ (PbI<sub>2</sub>).

#### Финансирование работы

Работа проведена при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-32-00417 — эксперимент), РНФ (проект 18-13-00409 — анализ результатов).

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

#### Список литературы

- D. Cao, C. Stoumpos, C. Malliakas, M. Katz, O. Farha, J. Hupp, M. Kanatzidis. Appl. Mater., 2, 091101 (2014).
- [2] Q. Chen, H. Zhou, T. Song, S. Luo, Z. Hong, H. Duan, L. Dou, Y. Liu, Y. Yang. Nano Lett., 14, 4158 (2014).
- [3] T. Du, C. Burgess, J. Kim, J. Zhang, J. Durrant, M. McLachlan. Sustainable Energy & Fuels, 1, 119 (2017).
- [4] Y. Kim, N. Jeon, J. Noh, W. Yang, J. Seo, J. Yun, A. Ho-Baillie, S. Huang, M. Green, J. Seidel, T. Ahn, S. Seok. Adv. Energy Mater., 6, 1502104 (2016).

- [5] J. Barb'e, M. Newman, S. Lilliu, V. Kumar, H. Ka, H. Lee, C. Charbonneau, C. Rodenburg, D. Lidzey, W. Tsoi. J. Mater. Chem. A, 6, 23010 (2018).
- [6] C. Bi, Y. Shao, Y. Yuan, Z. Xiao, C. Wang, Y. Gao, J. Huang. J. Mater. Chem. A, 2, 18508 (2014).
- [7] R. Misra, S. Aharon, B. Li, D. Mogilyansky, I. Visoly-Fisher, L. Etgar, E. Katz, J. Phys. Chem. Lett., 6, 326 (2015).
- [8] D. Saranin, V. Mazov, L. Luchnikov, D. Lypenko, P. Gostishev, D. Muratov, D. Podgorny, D. Migunov, S. Didenko, M. Orlova, D. Kuznetsov, A. Tameev, A. Di Carlo. J. Mater. Chem. C, 6, 6179 (2018).
- [9] Q. Wang, Y. Shao, H. Xie, L. Lyu, X. Liu, Y. Gao, J. Huang. Appl. Phys. Lett., 105, 163508 (2014).
- [10] T. Baikie, Y. Fang, J. Kadro, M. Schreyer, F. Wei, S. Mhaisalkar, M. Graetzel, T. White. J. Phys. Chem. A, 1, 5628 (2013).

Редактор Л.В. Шаронова

# Formation of two-phase structure in CH<sub>3</sub>NH<sub>3</sub>Pbl<sub>3</sub> organometallic perovskite

D.V. Amasev<sup>1</sup>, V.G. Mikhalevich<sup>1</sup>, A.R. Tameev<sup>2,3</sup>, S.R. Saitov<sup>4</sup>, A.G. Kazanskii<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences,
<sup>1</sup>19991 Moscow, Russia
<sup>2</sup> Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences,
<sup>1</sup>19071 Moscow, Russia
<sup>3</sup> Postovsky Institute of Organic Synthesis of the Ural Branch, Russian Academy of Sciences,
620137 Ekaterinburg, Russia
<sup>4</sup> Lomonosov Moscow State University,
119991 Moscow, Russia

**Abstract** The effect of annealing of an organometallic perovskite  $CH_3NH_3PbI_3$  film on its electrical, photoelectric, and optical properties is studied. It was shown that annealing at the temperature  $T_a > 140^{\circ}C$  leads to formation of a two-phase structure consisting of perovskite and lead iodide, the relative content of which depends on the annealing conditions, in particular on its temperature.  $PbI_2$  formation in the perovskite structure leads to a decrease in the conductivity and photoconductivity of the material. Our studies indicate the possibility of forming planar structures consisting of semiconductor materials with various values of the band gap: 1.6 eV ( $CH_3NH_3PbI_3$ ) and 2.4 eV ( $PbI_2$ ).